

# rohs检测仪 西凡 rohs检测仪

产品名称	rohs检测仪 西凡 rohs检测仪
公司名称	西凡仪器(深圳)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宝安区上南东路128号恒昌荣产业园2栋10楼西凡仪器
联系电话	13380399349 13380399349

## 产品详情

西凡仪器（深圳）有限公司成立于2006年，是一家集研发、生产和销售x射线荧光光谱仪的高新技术企业，主营产品包括ROHS检测仪、镀层测厚仪、硅油涂布量检测仪等众多无损检测仪器。XRF-T6SDD是西凡仪器结合ROHS检测标准及客户需求，rohs检测仪哪家好，专门针对无卤、ROHS、EN71等环保指令自主研发设计的一款RoHS检测仪，rohs检测仪多少钱，该产品采用美国进口定制的Fast-SDD探测器，大大提高了检测范围及精度，无需标样，无损，快速的检测Pb、Hg、Cd、Cr(VI)、CL、Br、PBB、PBDE等有害重金属物质，检测速度快，测试稳定性好、准确性高。

能量色散型X荧光光谱仪计量性能要求及校准条件:

### 一、能量色散型X荧光光谱仪计量性能要求

1、能量色散型X荧光光谱仪外观 仪器应有仪器名称、制造厂、出厂日期和编号的标志。 所有部件连接良好、动作正常。 面板上的仪表、指示灯和安全保护装置工作正常。

### 2、能量色散型X荧光光谱仪技术性能

技术性能包括仪器分辨力、信噪比、仪器的计数线性、重复性、稳定性。

分辨力：镉元素K 线脉冲高度的半峰宽应优于260eV。

信噪比：S/N应大于2。

仪器计数线性：90%仪器规定zui大线性计数率时的计数率偏差优于2.0%。

重复性：优于3.0% 稳定性：优于4.0%

## 二、能量色散型X荧光光谱仪校准条件:

### 1、校准的环境条件

环境温度：（15 - 30）

相对湿度： 80%，或按仪器说明书规定。

电源：电压AC（220 ± 22）V或（380 ± 38）V，频率（50 ± 1）Hz。

能量色散型X荧光光谱仪周围应无强烈交流电干扰，无强气流及酸、碱等腐蚀性气体。

仪器附近无强烈振动源。

仪器及电源应有良好接地。

西凡仪器（深圳）有限公司成立于2006年，是一家集研发、生产和销售x射线荧光光谱仪的高新技术企业，主营产品包括ROHS检测仪、镀层测厚仪、硅油涂布量检测仪等众多无损检测仪器。

XRF-T6SDD是西凡仪器结合ROHS检测标准及客户需求，专门针对无卤、ROHS、EN71等环保指令自主研发设计的一款RoHS检测仪，该产品采用美国进口定制的Fast-SDD探测器，大大提高了检测范围及精度，无需标样，无损，快速的检测Pb、Hg、Cd、Cr(VI)、CL、Br、PBB、PBDE等有害重金属物质，检测速度快，测试稳定性好、准确性高。

XF-AL产品主要应用用纸张或薄膜硅油涂布层厚度重量的测试仪器。满足于产品质量控制，产品采用先进的SDD探测器，分析范围广，样品无需做任何复杂的处理，便捷快速测试，仪器检出限能够达到0.01g/cm<sup>2</sup>，配置全功能的神经网络计算功能，ARM微电脑处理，便捷的预变成仪器参数，具有自定义开发方法功能。

西凡仪器（深圳）有限公司（展位号：1T45）将携以上产品亮相

2020深圳国际薄膜与胶带展（11月19-21日，深圳会展中心），欢迎大家前来参观咨询。

深圳国际薄膜与胶带展（FILM & TAPE EXPO）是薄膜胶带行业内集中展示高功能性薄膜和胶带成品以及制造设备和技术的展览会。深耕行业13载，持续为行业发展创新提供交流平台，汇聚超过800个来自薄膜胶带行业的品牌亮相，涂布模切设备专区，ICE Europe国际展区，日韩高机能膜展区，模切技术创新展区，化工原材料展区等5大展区涵盖各环节的创新材料，生产加工和智能制造技术解决方案。观众通过参与同期举办的技术论坛与行业精英面对面，洞察行业趋势，获取市场信息。体验展会线上线下商贸配对服务，与供应商交流技术方案，达成采购目的。

西凡仪器（深圳）有限公司成立于2006年，rohs检测仪，是一家集研发、生产和销售x射线荧光光谱仪的高新技术企业，主营产品包括ROHS检测仪、镀层测厚仪、硅油涂布量检测仪等众多无损检测仪器。

XRF-T6SDD是西凡仪器结合ROHS检测标准及客户需求，专门针对无卤、ROHS、EN71等环保指令自主研发设计的一款RoHS检测仪，该产品采用美国进口定制的Fast-SDD探测器，大大提高了检测范围及精度，无需标样，无损，rohs2.0检测仪，快速的检测Pb、Hg、Cd、Cr(VI)、CL、Br、PBB、PBDE等有害重金属物质，检测速度快，测试稳定性好、准确性高。

### 1、莫塞莱定律(Moseley ' s law)

反映各元素X射线特征光谱规律的实验定律。莫塞莱研究从铝到金的38种元素的X射线特征光谱K和L线，得出谱线频率的平方根与元素在周期表中排列的序号成线性关系。表明X射线的特征光谱与原子序数是一一对应的，使X荧光分析技术成为定性分析方法中可靠的方法之一。

### 2、布拉格定律(Bragg ' s law)

反映晶体衍射基本关系的理论推导定律，1912年英国物理学家布拉格父子（W.H. Bragg和W.L. Bragg）推导出了形式简单，能够说明晶体衍射基本关系的布拉格定律。此定律是波长色散型X荧光仪的分光原理，使不同元素不同波长的特征x荧光完全分开，使谱线处理工作变得非常简单，降低了仪器检出限。

### 3、比尔-朗伯定律(Beer-Lambert ' s law)

反映样品吸收状况的定律涉及到理论X射线荧光相对强度的计算问题。对于X射线荧光分析技术来说，原级射线传入样品的过程中要发生衰减，样品被激发后产生的荧光X射线在传出样品的过程中也要发生衰减，由于质量吸收系数的不同，使得元素强度并不是严格的与元素浓度成正比关系，而是存在一定程度的偏差。因而需要对此效应进行校正，才能准确的进行定量分析。

rohs检测仪多少钱-西凡(在线咨询)-rohs检测仪由西凡仪器(深圳)有限公司提供。西凡仪器(深圳)有限公司是一家从事“ROHS2.0检测仪,镀层测厚仪,硅油涂布量检测仪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“西凡”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使西凡在分析仪器中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！